

# 第三高調波交流帯磁率による超伝導体の臨界電流密度の評価

北村良平 (91232023) / 松下研究室

**1.はじめに** 一般に基本波交流帯磁率測定は、超伝導材料の臨界電流密度  $J_c$  や不可逆磁場などの特性評価に用いられるが、交流磁場の周波数が高い場合、磁束線に働く粘性力の影響などのために、 $J_c$  の値が正確に与えられないことがある。ここで第三高調波交流帯磁率は、基本波にくらべ信号は小さいが、上記の影響が少ないとことから、この測定を用いた評価法の優位性が注目されている。しかし、解析に量子化磁束の可逆運動の影響がある場合、現象を不可逆だとする臨界状態モデルが使えない。そこで、本研究では量子化磁束の可逆運動の影響がそれぞれ異なる高温酸化物超伝導体や金属系超伝導体試料について基本波及び第三高調波交流帯磁率を測定し、量子化磁束の可逆運動の影響を考慮したCampbell モデルを用いた解析により評価した  $J_c$  と、直流磁化からの見積った値を比較しながら、Campbell モデルを用いた解析法の正当性について論議する。

**2.測定** 試料は、Y 系の超伝導体粉、QMG 法による Y 系バルク超伝導体、Nb-Ti 平板、そして二種類の Nb-Ti 極細多芯線材の計五つである。測定したのは、SQUID による一定温度中の直流磁化  $\Delta M$  及び磁化曲線のマイナーカーブの傾き  $S$  と、基本波及び第三高調波交流帯磁率である。なお交流帯磁率法では、温度と直流磁場を固定して交流磁場依存性を求めた。

**3.結果及び検討** 図 1 に Y 系粉体の 83K における  $J_c$  の磁場依存性を示す。この場合試料内に存在する電流は粒内に局在した臨界電流密度のみであるから、交流帯磁率から求めた  $J_c$  と、直流磁化から求めた  $J_c$  とは同じ結果となるはずである。また、直流磁化から求めている値は不可逆の極限での値なので、真の値に近いと考えられる。しかしながら直流磁化から求めた  $J_c$  は交流帯磁率から求めた値と比べて小さい。一般に交流帯磁率から求めた値は量子化磁束の変位の小さい順 ( $\chi'_3$ ,  $\chi''_1$ ,  $\chi''_3$ ) に外れが大きく、過大評価になる。

次に、図 2 に Nb-Ti 平板の 4.5K における  $J_c$  の磁場依存性を示す。先に示した酸化物超伝導体と比べて、それぞれの交流帯磁率から求めた  $J_c$  が 1.5T 以下の磁気特性が不可逆なところで一致している。また量子化磁束の可逆運動が顕著となる 2T 付近から、直流磁化から求めた  $J_c$  と交流帯磁率から求めた  $J_c$  と見積もりが逆転し、帯磁率から求めた値が過大評価される傾向にある。この原因として高磁場になるにしたがって磁束線が熱揺動によって磁束線の運動を引き起こす磁束クリープの影響や、量子化磁束の変位とピン力密度との関係が Campbell モデルの記述からはずれていることが考えられる。

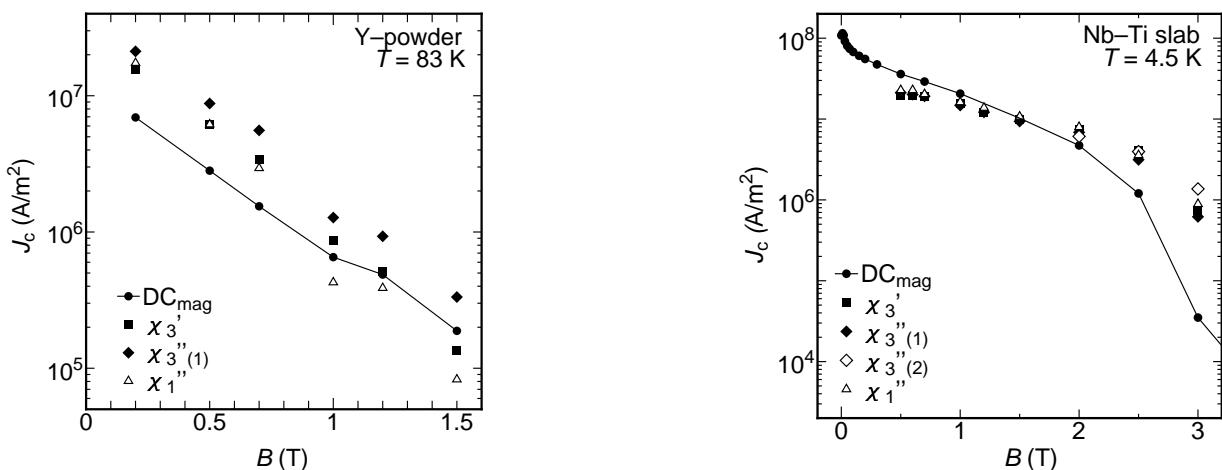


図 1:  $T = 83$  K における Y 系粉体の  $J_c$  の磁場依存性。

図 2:  $T = 4.5$  K における Nb-Ti 平板の  $J_c$  の磁場依存性。